

O b s a h s b o r n í k u

Spolehlivost v elektronice Ing. Pavel Říha, TESLA VUST Praha, s.p.	1
Záruky ukazatelů spolehlivosti elektronických zařízení a součástí Ing. Petr Brož, CSc., TESLA Strážnice	16
Růst spolehlivosti v období výskytu časných poruch Doc. Ing. František Židek, CSc., Slovenská vysoká škola technická Bratislava	23
Přínosy zvyšování spolehlivosti elektronických zabezpečovacích zařízení Prof. Ing. Milan Kejzlar, CSc., Vysoká škola dopravy a spojov Žilina	32
Diagnostický subsystém digitální telefonní ústředny Ing. Ondřej Chrobák, CSc., Výzkumný ústav telekomunikací Praha - TESLA	41
Spolehlivost subsystému chlazení elektronického zařízení Vladimír Honomichl, TESLA - ÚVR Opočinec	49
Sběr a vyhodnocení informací o provozní spolehlivosti Ing. Jaroslav Víšo	58
Sběr a vyhodnocení informací o provozní spolehlivosti zařízení radiolokační techniky Ing. Miloš Lulay, TESLA - ÚVR Opočinec	66
Příspěvek ke zrychleným zkouškám spolehlivosti elektronických systémů Doc. Ing. Stanislav Knaž, CSc., Doc. Ing. Lubomír Slunský, CSc. Vysoká škola dopravy a spojov Žilina	75
Výpočet parametrů spolehlivosti pomocí výpočetní techniky Ing. Ladislav Gabčo, Vysoká škola dopravy a spojov Žilina	85
Strojní pájení s nulovou chybou Ing. Bedřich Rous, TESLA Rožnov pod Radhoštěm	91

Spolehlivost pájených spojů Ing. Antonín Mařínek, TESLA VÚST Praha, s.p.	99
Spolehlivost v technologii povrchové montáže Ing. Václava Jiřová, CSc., TESLA Výzkumný ústav telekomunikací Praha	116
Certifikace součástek pro elektroniku dle vyhlášky 101/88 Sb. RNDr. Karel Jurák, CSc., Výzkumný ústav matematických strojů Praha	124
Faktory a poruchové mechanismy mikromontážních prací, určujících spolehlivost IO v plastů a hermetických pouzdrech Doc. Ing. Zdeněk Dragoun, CSc., Výzkumný ústav O70 Brno	132
Kontakty Au-Al integrovaných obvodů po dlouhodobém teplotním zatížení Ing. Rostislav Wasyluk, CSc., TESLA VÚST Praha, s.p.	140
K svodovým proudům integrovaných obvodů Ing. Jarmil Preis, CSc., TESLA VÚST Praha, s.p.	148
Prognosa spolehlivosti logických integrovaných obvodů Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula a kolektiv Vysoké učení technické v Brně	154
Použití metody DLTS u diskretních polovodičových součástek z hlediska spolehlivosti RNDr. Petr Janovský, Výzkumný ústav O70 Brno	162
Zkušenosti se simulací tepelné únavy výkonových prvků Ing. Radim Briš, TESLA Rožnov	168
Degradační procesy v optonech Ing. Alběna Čermáková, CSc. a kolektiv Vysoké učení technické v Brně	183
Zjišťování potenciálních zdrojů poruch mikrovlňných diod a tranzistorů Stenislav Urban, p.ch., CSc., TESLA VÚST Praha, s.p.	193

- Metodika výzkumu součástí z elektrokeramiky  
Ing. Jan Marek, Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky  
Hradec Králové 203
- Sledování šumu částečných výbojů v kondenzátorech  
TESLA, typu TC 219  
Prof. RNDr. Ing. Josef Šíkula a kolektiv  
Vysoké učení technické v Brně 208